

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. März 2005 (03.03.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/020075 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G06F 11/277,**
G01R 31/3185

[DE/DE]; Max-Planck-Str. 16, 15831 Mahlow (DE).
LEININGER, Andreas [DE/DE]; Auenstr. 100a, 80469
München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001799

(74) **Anwalt: SCHÄFER, Horst**; c/o Kanzlei Schweiger &
Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. August 2004 (11.08.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 38 922.9 20. August 2003 (20.08.2003) DE

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) **Erfinder; und**

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): GOESSEL, Michael**

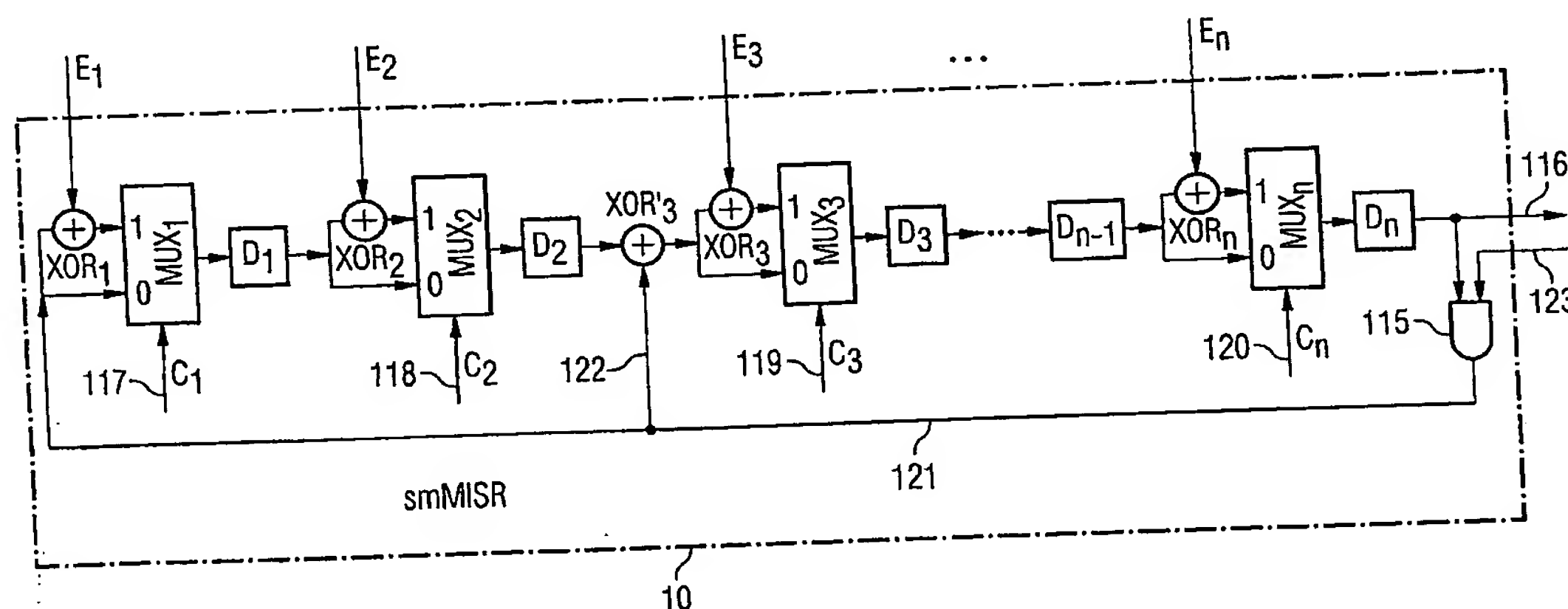
(81) **Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart):** AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart):** ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** ELECTRIC DIAGNOSTIC CIRCUIT AND METHOD FOR TESTING AND/OR DIAGNOSING AN INTEGRATED
CIRCUIT

(54) **Bezeichnung:** ELEKTRISCHE DIAGNOSESCHALTUNG SOWIE VERFAHREN ZUM TESTEN UND/ODER ZUR DIA-
GNOSE EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG



(57) **Abstract:** The electric diagnostic circuit for testing an integrated circuit comprises a number of external inputs (E), a number of essentially similar switching units, which are situated one behind the other, and a circuit output (116). The switching units are designed so that they can be controlled whereby an input signal applied to the internal input of the switching unit can, according to a control signal of the switching unit, either be relayed without being altered to the internal input of the switching unit situated therebehind or can be linked to the test signal applied to the external input (E).

(57) **Zusammenfassung:** Die elektrische Diagnoseschaltung zum Testen eines integrierten Schaltkreises umfasst mehrere externe Eingänge (E), mehrere im wesentlichen gleichartige, hintereinander angeordnete Schalteinheiten sowie einen Schaltungsausgang (116). Die Schalteinheiten sind derart steuerbar ausgebildet, dass ein am internen Eingang der Schalteinheit anliegendes Eingangssignal in Abhängigkeit eines Steuersignals der Schalteinheit entweder unverändert an den internen Eingang der jeweils dahinter angeordneten Schalteinheit weiterleitbar oder mit dem jeweils am externen Eingang (E) anliegenden Testsignal verknüpfbar ist.

WO 2005/020075 A1



ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.